Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук

объявляет конкурс на замещение вакантной должности

младшего научного сотрудника

в лаборатории дифракционных методов исследования реальной структуры кристаллов *Вакансия VAC_PTI_22132*

Тематика исследований.

Просвечивающая электронная, растровая и гелиевая ионная микроскопия кристаллов и пленок широкозонных полупроводников (SiC, AlN, hBN) и тонких покрытий (графен). Изучение люминесценции нитрида бора и нитрида алюминия. Комплексные исследования реальной структуры кристаллов с привлечением рентгеновской дифрактометрии.

Трудовая деятельность.

Непосредственное участие в фундаментальных и прикладных научных исследованиях по заявленной тематике:

- 1. проведение экспериментальных исследований комплексом методов электронной микроскопии;
- 2. сочетание электронной микроскопии с катодолюминесценцией;
- 3. анализ и интерпретация экспериментальных данных;
- 4. участие в публикации результатов;
- 5. освоение новой информации, изложенной на английском и русском языках;
- 6. подготовка и представление докладов на российских и международных конференциях.

Конкретные обязанности будут определяться заведующим лабораторией, исходя из квалификации соискателя.

Требования к претенденту.

- 1. Высшее образование.
- 2. Стаж научной работы не менее 5 лет.
- 3. Опыт использования методов просвечивающей электронной, растровой и гелиевой ионной микроскопии.
- 4. Наличие публикаций в научных журналах, индексируемых Scopus и входящих в ядро РИНЦ и WoS (не менее 10 за последние 5 лет).
- 5. Опыт работы в научных коллективах.
- ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 26 144 руб.
- CTABKA: 0.4
- СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: 18 000 руб.
- Срок трудового договора 5 лет

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы

• копии документов о высшем профессиональном образовании;

• сведения о научной работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса, список публикаций;

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, учёному секретарю ФТИ им. А.Ф. Иоффе М.И. Патрову, телефон для справок: (812) 297 22 45